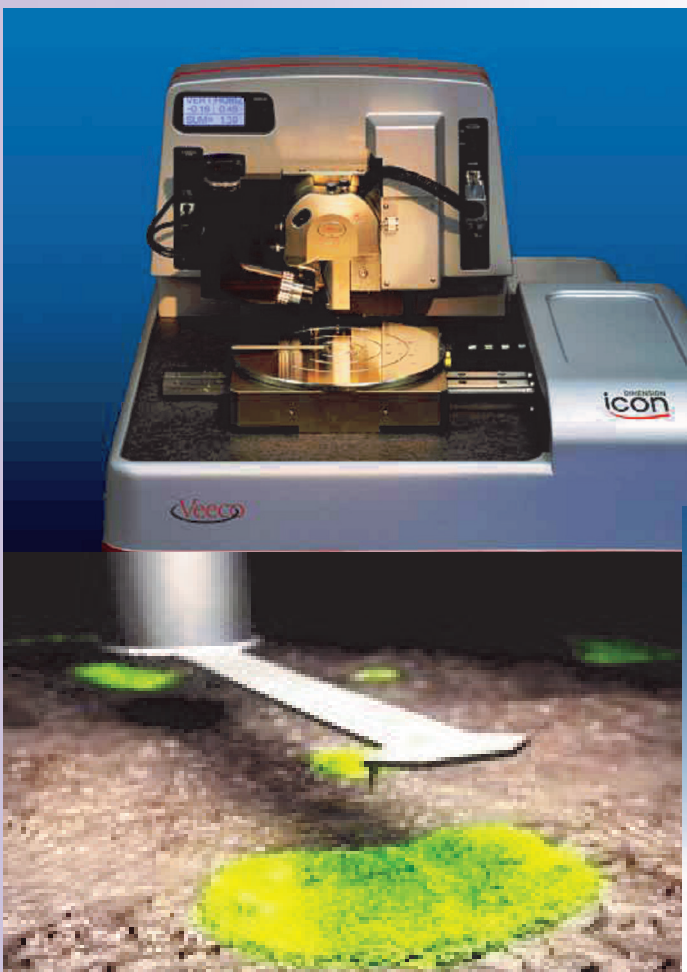




**Nuove piattaforme e nuove tecniche di
caratterizzazione tramite
Scanning Probe Microscopy
Universita' di Napoli
Fac. Di Ingegneria - Aula CRIB
P.le Tecchio 8 - Napoli
21.04.2009**



2M STRUMENTI S.R.L. — Via G. Pontano, 9 — 00141 Roma (RM)
tel. +39 06 86895319 - fax +39 06 86895241
E-mail: marketing@2mstrumenti.com — www.2mstrumenti.com
and **VEECO INSTRUMENTS**